

しょうかくさんらんほう

小角散乱法

■ 用語解説 ■

X線小角散乱とは、X線を物質に照射して散乱する X線のうち、散乱角が小さいものを測定することにより物質の構造情報を得る手法である。X線の散乱を、角度によって分類した場合、小角散乱と広角散乱（回折）とに大別される。どの程度の散乱角度から小角散乱というかは場合によって異なるが、通常は10度以下の場合をいう。広角散乱を利用する分析法（X線回折）が結晶中の原子配列のようなオングストロームオーダーの分析に使用されるのに対し、小角散乱法では微粒子や液晶、合金の内部構造といった数ナノメートルレベルでの規則構造の分析に用いる。